

PCT/FR 0 3 / 0 2 0 6 3
22 JUL. 2003**BREVET D'INVENTION**

REC'D 30 SEP 2003

WIPO PCT

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION**COPIE OFFICIELLE**

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 07 JUL. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

BEST AVAILABLE COPY

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



16 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ
Code de la propriété intellectuelle - Livre VI


N° 11354*01

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

FR 513 W / 24CB99

Réservé à l'INPI

REMISE DES PIÈCES
DATE

LIEU **8 JUIL 2002**

N° D'ENREGISTREMENT
75 INPI PARIS

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

0208543

DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE
PAR L'INPI

08 JUIL. 2002

Vos références pour ce dossier

(facultatif)

104308/RF/OOCD/TPM

NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE
À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

COMPAGNIE FINANCIERE ALCATEL
Département PI
Michel Robert FOURNIER
30 avenue Kléber
75116 PARIS

Confirmation d'un dépôt par télécopie

☐ N° attribué par l'INPI à la télécopie

2 NATURE DE LA DEMANDE

Cochez l'une des 4 cases suivantes

Demande de brevet

☒

Demande de certificat d'utilité

☐

Demande divisionnaire

☐

Demande de brevet initiale

N°

Date

ou demande de certificat d'utilité initiale

N°

Date

Transformation d'une demande de
brevet européen *Demande de brevet initiale*

☐

N°

Date

3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

LASER DFB A REFLECTEUR DISTRIBUE A BANDE PHOTONIQUE INTERDITE

4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ
OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE
LA DATE DE DÉPÔT D'UNE
DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

☐ S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

5 DEMANDEUR

☐ S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

Nom ou dénomination sociale

ALCATEL

Prénoms

Société Anonyme

Forme juridique

N° SIREN

5.4.2.0.1.9.0.9.6

Code APE-NAF

Adresse

Rue

54, rue La Boétie

Code postal et ville

75008 PARIS

FRANCE

Pays

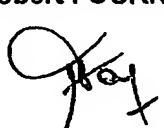

Française

Nationalité

N° de téléphone (facultatif)

N° de télécopie (facultatif)

Adresse électronique (facultatif)

REMISE DES PIÈCES DATE 3 JUIL 2002 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI 0208543		Réservé à l'INPI		CE 543 W / 78/893	
Vos références pour ce dossier : <i>(facultatif)</i>			104308/RF/OOCD/TPM		
6 MANDATAIRE					
Nom			FOURNIER		
Prénom			Michel Robert		
Cabinet ou Société			Compagnie Financière Alcatel		
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			PG 9222		
Adresse	Rue		30 Avenue Kléber		
	Code postal et ville		75116 PARIS		
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>					
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>					
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>					
7 INVENTEUR (S)					
Les Inventeurs sont les demandeurs			<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée		
8 RAPPORT DE RECHERCHE			Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)		
Établissement immédiat ou établissement différé			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Paiement échelonné de la redevance			Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non		
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES			Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence) :		
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes					
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)			Michel Robert FOURNIER / LC 40 B 		
			VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI 		

LASER DFB À RÉFLECTEUR DISTRIBUÉ À BANDE PHOTONIQUE INTERDITE

L'invention concerne le domaine des dispositifs optiques, et plus
5 particulièrement celui des lasers à semi-conducteurs de type DFB (Distributed
FeedBack).

Comme le sait l'homme de l'art, les lasers DFB, comme par exemple
ceux dits « à ruban enterré », comprennent généralement un guide d'onde
actif, comportant classiquement une région active, enterré dans un matériau
10 de rebouchage, et couplé à des structures formant un réseau de diffraction
(ou réflecteur distribué) grâce à une variation périodique d'indice. En termes
de structure guidante, la région active est assimilable au cœur du guide tandis
que le matériau de rebouchage qui l'entoure, à plus faible indice, correspond
à sa gaine.

15 Le réflecteur distribué apportant une modification périodique de
l'indice de réfraction, seuls des photons émis par la région active et
présentant une longueur d'onde imposée par le réflecteur contribuent à
l'oscillation laser. Par conséquent, un laser DFB présente, en théorie, une
empreinte spectrale étroite qui en fait un laser monomode.

20 Mais, dans la pratique, tel n'est pas exactement le cas du fait de la
complexité des procédés utilisés actuellement pour fabriquer les réflecteurs
distribués. Il faut en effet que les réflexions au niveau des extrémités du laser
(typiquement des facettes opposées du composant) soient en phase avec les
réflexions induites par le réseau du réflecteur distribué. Ces conditions de
25 phase ne peuvent être obtenues qu'en positionnant la facette du laser de
manière très particulière par rapport au réseau de diffraction, et ceci avec une
précision très inférieure à la longueur d'onde.

Par ailleurs, ce mode de fabrication des réflecteurs distribués ne
permet que difficilement de faire varier la force du réseau (en anglais "grating
30 strength"), c'est à dire le coefficient de couplage entre l'onde optique et le
réseau, d'un laser à l'autre sur une même plaquette (en anglais « wafer »). De

même, il est difficile de faire varier avec précision la force du réseau le long de l'axe longitudinal du laser.

Des solutions ont été proposées pour tenter de remédier à ces inconvénients. Une solution consiste simplement à dédier une plaquette à chaque type de réflecteur distribué. Mais, cette solution est onéreuse. Une
 5 autre solution consiste à désorienter le réseau pour réduire sa force de réseau. Mais, cette solution change la longueur d'onde de Bragg du réseau, et peut en outre diffracter des photons dans des directions indésirables. Elle ne permet pas non plus de faire varier la force du réseau le long de l'axe
 10 longitudinal du laser DFB.

L'invention a donc pour but de remédier à tout ou partie des inconvénients précités.

Elle propose à cet effet un laser semi-conducteur, du type présenté dans l'introduction et selon lequel le réflecteur distribué est réalisé dans le
 15 matériau de rebouchage qui entoure la région active du guide d'onde actif, le long d'au moins un de ses côtés latéraux (de préférence les deux), et sensiblement parallèlement à ceux-ci, sous la forme d'au moins une première structuration présentant une bande photonique interdite selon l'axe longitudinal du laser.

Classiquement, on considère qu'une structure laser s'étend selon
 20 trois directions perpendiculaires entre elles, une direction dite « longitudinale » (X), définissant l'axe longitudinal du laser par rapport à laquelle on définit son extension longitudinale L (ou longueur), une direction dite « latérale » (Y), par rapport à laquelle on définit par exemple l'extension latérale l (ou largeur) de
 25 la région active du guide d'onde, et une direction dite « verticale » (Z), selon la direction d'empilement des couches et par rapport à laquelle on définit par exemple l'extension verticale h (ou hauteur) de la région active du guide d'onde. Par conséquent, l'expression « le réflecteur distribué est réalisé le long d'au moins un des côtés latéraux de la région active » signifie que le
 30 réflecteur s'étend sur toute la longueur L de la région active du laser, ou sur une partie de celle-ci, sensiblement parallèlement à un plan défini par les directions verticale (Z) et longitudinale (X). Les expressions "extension

longitudinale", "extension latérale" et "extension verticale" sont utilisées de préférence aux termes plus communs "longueur", "largeur" et "hauteur" respectivement car ils visent à désigner des caractéristiques géométriques de structures et non pas de simples dimensions.

5 Par ailleurs, on entend ici par « structuration à bande photonique interdite » un réseau n-dimensionnel (n étant de préférence égal à 2, mais pouvant également être égal à 1 ou à 3) dont les propriétés physiques offrent un contrôle de la propagation de la lumière, en l'interdisant pour certaines longueurs d'onde dans certaines directions de l'espace.

10 Le réflecteur distribué selon l'invention sert donc à filtrer dans la direction longitudinal certaines longueurs d'onde et non pas à assurer un confinement latéral et vertical, lequel est assuré par la constitution même de la région active enterrée. Cela permet notamment de fixer la force du réseau à toute valeur voulue en jouant principalement sur la distance séparant le
15 réseau de la couche active.

La première structuration s'étend préférentiellement sur la totalité de l'extension latérale (ou largeur) du matériau de rebouchage placé de part et d'autre des côtés latéraux de la région active. Mais, elle pourrait également s'étendre sur une partie seulement de cette extension latérale.

20 En outre, la première structuration s'étend sur une partie au moins de l'extension de la région active

suivant la direction verticale, préférentiellement sur sa totalité, et sur une partie ou la totalité de la hauteur du matériau de rebouchage.

Dans un mode de réalisation préféré, la première structuration est un
25 premier cristal photonique formé par gravure localisée du matériau de rebouchage de façon à y former des colonnes creuses ou à y laisser subsister des colonnes de matériau, ces colonnes constituant un réseau périodique d'éléments diffractants présentant dans un plan horizontal une maille ayant des dimensions de l'ordre de la longueur d'onde de fonctionnement du laser.
30 Plus préférentiellement encore, les colonnes s'étendent sensiblement parallèlement à la direction d'empilement des couches.

Par ailleurs, la maille de réseau du premier cristal photonique a préférentiellement une forme de polygone convexe, et dont la taille est choisie en fonction de la longueur d'onde de fonctionnement recherchée. Ce polygone convexe est de préférence un polygone régulier (c'est-à-dire dont
 5 tous les côtes sont égaux), tel qu'un carré, un triangle équilatéral ou un losange.

La première structuration est espacée de la région active d'une distance choisie en fonction de la force du réseau requise pour le réflecteur distribué, de sorte que soient extraits les photons qui présentent une longueur
 10 d'onde différente de celle des photons dans le mode recherché.

Selon une autre caractéristique de l'invention, cette distance peut être soit constante, soit variable le long de l'extension longitudinale (ou longueur) L de la région active de manière à faire varier longitudinalement la force du réseau. L'intérêt de cette dernière disposition est qu'elle permet de réaliser
 15 des lasers à sélectivité spectrale améliorée, par exemple en contrôlant la distribution longitudinale de la densité de puissance dans la structure laser.

Selon encore une autre caractéristique de l'invention, le matériau de rebouchage du guide d'onde actif peut être également prévu à l'une au moins des extrémités longitudinales de la région active, de manière à recevoir, à une
 20 distance δL des extrémités longitudinales de la première structuration, des moyens de réflexion réalisés sous la forme d'une seconde structuration à bande photonique interdite et s'étendant sensiblement parallèlement à l'extension latérale de la région active. Cette seconde structuration sert de miroir arrière pour le laser DFB. Par ailleurs, la distance δL peut être choisie
 25 sensiblement égale à un nombre entier de fois la demie longueur d'onde des photons dans le mode guidé (c'est-à-dire la demie longueur d'onde de fonctionnement du laser dans le matériau de rebouchage), de sorte que les première et seconde structurations définissent une cavité résonnante de type Fabry-Pérot.

30 Préférentiellement, cette seconde structuration s'étend sur la totalité de l'extension latérale (ou largeur) du guide d'onde. Mais, elle pourrait s'étendre sur la largeur de la région active et tout ou partie de l'extension

latérale du matériau de rebouchage placé de part et d'autre des côtés latéraux de la région active (dans les zones où est formée la première structuration). De même, elle s'étend de préférence sur toute la hauteur (direction d'empilement) de la région active, et plus préférentiellement encore sur toute la hauteur du matériau de rebouchage qui entoure notamment la région active.

Egalement de préférence, la seconde structuration est un second cristal photonique formé par gravure localisée du matériau de rebouchage de façon à y former des colonnes creuses ou à y laisser subsister des colonnes de matériau, ces colonnes constituant un réseau périodique d'éléments diffractants présentant dans un plan horizontal une maille ayant des dimensions de l'ordre de la longueur d'onde de fonctionnement du laser.

Dans ce cas, il est préférable que les colonnes s'étendent sensiblement parallèlement à l'extension verticale (ou hauteur h) de la région active, sur tout ou partie (région active au moins) du guide d'onde. Il est également avantageux que la maille de réseau du second cristal photonique ait une forme de polygone convexe, de préférence d'un polygone régulier.

Avantageusement, les polygones convexes des premier et second cristaux photoniques sont associés à des longueurs d'onde de Bragg sensiblement identiques. Par ailleurs, dans un mode de réalisation préférentiel les premier et second cristaux photoniques sont constitués de polygones convexes de types différents.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à l'examen de la description détaillée ci-après, et des dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 est une vue en coupe transversale schématique, dans le plan (YZ), d'un laser DFB selon l'invention, équipé d'un premier type de cristal photonique,
- la figure 2 est une vue en coupe transversale, selon l'axe A de la figure 1 (dans le plan (XY)),

- la figure 3 est une vue en coupe identique à celle de la figure 2, mais illustrant un laser DFB équipé d'un second type de cristal photonique,
- la figure 4 est une vue en coupe identique à celle de la figure 2, mais illustrant un autre laser DFB selon l'invention, équipé d'un premier cristal photonique définissant le réflecteur distribué, et d'un second cristal photonique, définissant un réflecteur arrière.

Les dimensions des différents éléments constituant les lasers DFB illustrés sur les figures ne sont pas représentatives de leurs dimensions réelles respectives.

10 Le repère (X,Y,Z) illustré sur les figures 1 à 4 définit les directions perpendiculaires suivant lesquelles s'étend la structure laser DFB de l'invention. L'axe X définit la direction longitudinale du laser (selon sa longueur L). L'axe Y définit la direction latérale du laser (selon sa largeur l). Et l'axe Z définit la direction verticale d'empilement des couches (par convention, on appelle « partie inférieure » du laser le bas de la figure 1, et « partie

15 supérieure » du laser le haut de la figure 1).

On se réfère tout d'abord aux figures 1 et 2 pour décrire un premier exemple de réalisation d'un laser DFB selon l'invention.

Ce laser DFB comporte tout d'abord un substrat 1 (par exemple de type n), réalisé dans un matériau semiconducteur III-V, tel que par exemple

20 l'InP ou le GaAs. Il comporte également un guide d'onde actif 3, formé par une technique de gravure, situé au dessus du substrat 1 et constitué d'une région active 4, dans laquelle sont produits les photons du mode guidé, et entourée verticalement d'un matériau de confinement optique non dopé 12.

25 Le laser DFB comporte enfin un matériau de rebouchage 5, par exemple en InP dopé p, entourant latéralement et verticalement le guide d'onde actif 3. Sur la figure 1, la frontière 2, entre la région gravée comportant le guide d'onde actif 3 et la région contenant le matériau de rebouchage 5, est matérialisée par des pointillés. Cet exemple de laser DFB est, du fait de son

30 mode de réalisation, du type dit « à ruban enterré ».

Le guide d'onde actif 3 est couplé à un réflecteur distribué réalisé ici sous la forme de deux réseaux diffractants 7, 8 identiques, formés dans les parties latérales du matériau de rebouchage 5, situées de part et d'autre des côtés longitudinaux (ou latéraux) de la région active 4, définis par le plan (X, Z), et sensiblement parallèlement à ces côtés.

Chaque réseau 7, 8 est une structuration particulière du matériau de rebouchage 5, dite « à bande photonique interdite ». Par conséquent, on assimile dans ce qui suit un réseau à sa structuration. Ce type de réseau n-dimensionnel (n étant de préférence égal à 2, mais pouvant également être égal à 1 ou à 3) est bien connu de l'homme de l'art. Il est notamment décrit dans le document de E. Yablanovitch, J. opt. Soc. Am. B 10, 283 (1993), « photonic bandgap structures ». Comme son nom l'indique, il est conçu de manière à posséder une ou plusieurs bandes d'énergie qui sont interdites à certains photons de lumière qui sont émis dans la région active 4. Il permet donc de contrôler (filtrer) la propagation de la lumière, voire même interdire la propagation de certaines de ces longueurs d'onde.

Comme indiqué précédemment, les réseaux 7, 8 servent donc à filtrer certaines longueurs d'onde et non pas à assurer un confinement latéral et vertical, lequel est assuré par la constitution même de la région active 4 et du fait qu'elle est entourée par les matériaux de confinement optique 12 et de rebouchage 5. Mais, ils ont une fonction complémentaire. Leur bande interdite photonique est en effet choisie de manière à assurer un confinement optique « longitudinal » pour la lumière ayant la longueur d'onde de fonctionnement voulue. Cette lumière doit pouvoir pénétrer dans le réseau latéralement, mais elle « voit » la bande interdite photonique dans la direction longitudinale (axe X). En d'autres termes, cette bande d'énergie interdite empêche en quelque sorte la propagation dans le réseau de la lumière suivant la direction longitudinale (axe X) et induit, selon sa relation de phase avec les facettes, des situations de résonance permettant de sélectionner la longueur d'onde du mode guidé. On peut également présenter cette caractéristique comme une inhibition de la propagation longitudinale par couplage entre le réseau et l'onde émise en fonction des conditions de réflexions des facettes.

Préférentiellement, la structuration 7, 8 s'étend sur la totalité de la longueur L de la région active 3. Egalement de préférence, la structuration 7, 8 s'étend sur la quasi totalité de la largeur du matériau de rebouchage 5 qui se trouve placé de part et d'autre de la région active 4. En fait, il est important
5 que la structuration s'étende sur une partie du mode optique. Toujours de préférence, la structuration 7, 8 s'étend sur la totalité de la hauteur du ~~matériau de rebouchage 5 qui se trouve placé de part et d'autre des côtés~~
longitudinaux (ou latéraux) de la région active 4. Comme illustré sur la figure 1, la structuration 7, 8 peut également se prolonger dans une partie au moins
10 du substrat 1.

Dans l'exemple illustré sur la figure 2, la structuration 7, 8 définit un cristal photonique de trous en forme de colonnes 9 qui s'étendent sensiblement suivant la direction verticale (axe Z) et constituent des éléments diffractants qui assurent une variation périodique de la constante diélectrique.
15 De tels trous 9 peuvent être réalisés à l'aide de techniques de gravure localisée telles que la gravure sèche et la gravure par faisceau d'électrons, parfaitement connues de l'homme de l'art. Grâce à ce mode de réalisation du réflecteur distribué, on évite les étapes de reprise de croissance souvent délicates et onéreuses.

20 En variante, on pourrait réaliser un cristal photonique constitué de colonnes de matériau. Les colonnes sont aussi formées par gravure localisée du matériau de rebouchage, mais de façon à y laisser subsister des colonnes de matériau.

Vu dans un plan horizontal, le réseau du cristal photonique est
25 périodique et présente une maille en forme de polygone convexe. Le nombre de périodes et le pas du réseau suivant l'axe X (lié à la dimension de la maille) et les dimensions des trous (ou colonnes) sont choisis en fonction de la longueur d'onde de fonctionnement recherchée du laser. Ce pas est typiquement de l'ordre de cette longueur d'onde. Par ailleurs, le type du
30 réseau (tout comme le pas) est choisi en fonction de la bande photonique interdite désirée.

Comme illustré, ce type est de préférence carré. Mais il pourrait également s'agir de triangles équilatéraux ou de losanges dont les cotés sont de tailles sensiblement égales.

Le cristal photonique, notamment du fait de son mode de réalisation, offre un avantage important. Il permet en effet de contrôler précisément ce que l'homme de l'art appelle la force du réseau (en anglais « grating strength ») ou coefficient de couplage, qui caractérise l'intensité du couplage entre le réseau et les ondes associées aux photons émis. Grâce au fait que le réseau est situé dans le matériau de rebouchage, en dehors du matériau actif, cette force du réseau dépend en effet au premier ordre, principalement, de la distance d qui sépare le bord du réseau 7, 8 du bord longitudinal (ou côté latéral) de la région active 4, et qui est un paramètre important en matière de filtrage de la longueur d'onde des photons. Il en résulte que l'ajustement de la force de couplage peut être obtenu par un simple dimensionnement de la distance d , de façon sensiblement indépendante des autres paramètres de la structure laser.

Comme illustré dans l'exemple de réalisation de la figure 2, la distance d peut être constante. Mais, comme illustré dans l'exemple de réalisation de la figure 3, la distance d peut varier le long de l'extension longitudinale L (axe X) de la région active 4. Dans cette variante de la figure 2, le cristal photonique 7, 8 présente une partie « gauche » placée à la distance d_1 de la région active 3, et une partie « droite » placée à la distance d_2 de cette même région active. Dans cet exemple les parties droite et gauche présentent la même forme de maille (carrée), mais elles pourraient présenter des formes différentes pour offrir simultanément des bandes photoniques interdites différentes et des forces de réseau différentes. D'une façon générale, la loi de variation de cette distance en fonction de la position longitudinale dépend de l'effet recherché et peut être obtenue grâce aux logiciels de simulation dont disposent les équipes de développement des composants optoélectroniques.

Typiquement, on peut ainsi optimiser la sélectivité spectrale du laser. Ce mode de réalisation permet par exemple de compenser spatialement ce

que l'homme de l'art appelle en anglais le « hole burning », qui résulte d'interférences survenant dans le réseau du fait de la propagation du champ selon des directions opposées. En effet, lorsque la structure laser est sensiblement uniforme, la distribution de la densité de puissance présente
 5 généralement des creux et des ventres. A forte puissance de fonctionnement du laser, la densité de porteurs dans la région active se trouve donc saturée

 au niveau des ventres, et cette répartition inhomogène le long de la structure dégrade la sélectivité spectrale. Grâce à l'invention, il est désormais possible de contrôler facilement la distribution de la densité de puissance dans la
 10 structure laser.

On peut également envisager une autre variante dans laquelle la distance d est constante le long de la région active 4, mais avec un réseau diffractant constitué de deux cristaux photoniques, voire plus, présentant des mailles différentes pour offrir des bandes photoniques interdites différentes
 15 localement.

La distance d ou les distances d_i ($i=1, 2$ sur la figure 3) sont préférentiellement contrôlées par masquage lors de l'étape de lithographie, typiquement à l'échelle du nanomètre.

On se réfère maintenant à la figure 4 pour décrire un autre exemple
 20 de réalisation de laser DFB selon l'invention.

Il s'agit d'une variante du laser illustré sur les figures 1 à 3, dans laquelle l'extrémité longitudinale arrière (ou gauche) de la région active 4 est également entourée de matériau de rebouchage 5 dans lequel est formé un miroir réfléchissant arrière 10 réalisé sous la forme d'une structuration à
 25 bande photonique interdite tandis que l'extrémité longitudinale avant, opposée, est une face miroir classique 11 du composant munie d'un revêtement anti-réfléchissant. Dans une variante, chaque face d'extrémité longitudinale pourrait être équipée d'une structuration à bande photonique interdite.

30 Ce mode de réalisation est destiné à réduire, voire supprimer, les variations de comportement spectral et/ou de seuil et/ou de rendement et/ou d'autres paramètres qui surviennent entre lasers DFB de même type en

raison des variations de l'ordre de la fraction de longueur d'onde des positions des facettes relativement aux réflecteurs distribués.

La structuration du miroir arrière 10 est similaire à celle des réflecteurs distribués 7, 8 présentés en référence aux figures 1 et 2. Elle peut par conséquent être réalisée lors de la même étape. Elle s'étend dans le matériau de rebouchage sensiblement perpendiculairement au plan (X, Y), et donc sensiblement suivant la direction verticale Z.

Cette structuration 10 (que l'on assimile ci-après au miroir arrière) s'étend sur une partie au moins de la largeur l du guide d'onde 3, et au moins sur toute la largeur de la région active 4 et la zone d'extension latérale de la première structuration 7, 8. Par ailleurs, cette structuration s'étend au moins sur la hauteur de la région active 4, mais de préférence sur toute la hauteur h du guide d'onde 3.

Par ailleurs, comme dans la première structuration, cette seconde structuration 10 définit sensiblement un second cristal photonique de trous 13 qui s'étendent sensiblement suivant la direction verticale (axe Z) et constituent des éléments diffractants qui assurent une variation périodique de la constante diélectrique. En variante, on pourrait réaliser un cristal photonique de colonnes à la place du cristal photonique de trous.

Comme le premier cristal photonique, ce second cristal photonique est préférentiellement un réseau périodique et présentant une maille en forme de polygone convexe. De même, le nombre de périodes et le pas du réseau suivant l'axe X (lié à la dimension de la maille) et les dimensions des trous (ou colonnes) sont choisis en fonction de la longueur d'onde de fonctionnement recherchée du laser. Ce pas est typiquement de l'ordre de cette longueur d'onde. Par ailleurs, le type du réseau (tout comme le pas) est choisi en fonction de la bande photonique interdite désirée.

Comme illustré sur la figure 4, ce type est de préférence à maille triangulaire équilatéral. Mais, il pourrait également s'agir de carrés (éventuellement identiques à ceux du premier cristal photonique) ou de losanges dont les côtés sont de tailles sensiblement égales. En effet, le réseau latéral 7, 8 doit présenter une bande interdite selon l'axe longitudinal,

mais préférentiellement pas selon l'axe latéral, tandis que le réseau 10 en extrémité de laser peut préférentiellement présenter une bande interdite selon ces deux directions (latérales et longitudinale).

Les polygones convexes des premier et second cristaux photoniques
 5 sont de préférence dimensionnés de façon à présenter des longueurs d'onde de Bragg sensiblement identiques.

La seconde structuration 10 est formée à une distance δL de l'extrémité longitudinale arrière de la première structuration 7, 8. Ce mode de réalisation de réflecteur au moyen du second cristal photonique permet de
 10 contrôler précisément, typiquement à l'échelle du nanomètre, la distance δL qui contribue de façon importante aux propriétés du laser DFB, et notamment à son taux de réjection des modes secondaires ("SMSR"), son seuil et son rendement.

Par ailleurs, cette distance δL peut être choisie sensiblement égale à
 15 un nombre entier de fois la demie longueur d'onde des photons dans le mode guidé (c'est-à-dire la demie longueur d'onde de fonctionnement dans le matériau), de sorte que les première et seconde structurations définissent une cavité résonnante de type Fabry-Pérot accordée sur la longueur d'onde de fonctionnement du laser.

20 Un laser DBF équipé d'un réflecteur distribué à distance d_i variable, du type de celui illustré sur la figure 3, peut être également équipé d'un miroir arrière et/ou d'un miroir avant à bande photonique interdite, du type de celui illustré sur la figure 4.

Des dimensions typiques des éléments d'une structure du type de
 25 celle illustrée sur la figure 4 sont données ci-après, à titre d'exemple non limitatif.

Pour réaliser par exemple sur une même plaque un ensemble de puces laser couvrant des longueurs d'onde de la bande C, on peut former un miroir d'extrémité large bande comportant une vingtaine de rangées de
 30 cristaux triangulaires équilatéraux et présentant un coefficient de remplissage d'air d'environ 0,3 et une période (distance entre barycentres des triangles) de

l'ordre de 340 nm, pour une lumière incidente selon une direction parallèle à la médiatrice des triangles. La période peut présenter des variations d'environ 10 nm, étant donné que l'on attend des réflexions large bande sur environ 100 nm.

5 Le réflecteur latéral, à coefficient de remplissage d'air d'environ 0,3, peut être réalisé à l'aide d'un simple réseau unidimensionnel (1D), avec une modulation suivant l'axe X et une longueur d'onde de Bragg adaptée à la longueur d'onde d'émission du laser. Pour obtenir une longueur d'onde
10 d'émission d'environ 1550 nm, avec un dispositif présentant un indice effectif d'environ 3,2, la période doit être d'environ 242,2 nm. L'extension latérale du cristal doit être au moins égale à celle du mode transverse, soit typiquement 10 μm de chaque côté.

La distance de séparation entre les bords longitudinaux (ou latéraux) de la région active 4 et les réflecteurs latéraux placés de part et d'autre de ces
15 bords est en moyenne de l'ordre du micromètre. Mais, elle peut varier localement de 0 à 10 μm afin de couvrir une large plage de forces de réseau. Par ailleurs, pour une tolérance d'environ 10 nm sur la longueur d'onde d'émission du laser, il est nécessaire de contrôler la période à $\pm 0,8$ nm environ.

20 La distance optique entre les réflecteurs latéraux et le réflecteur d'extrémité peut être égale à environ 242,2 nm de manière à être de l'ordre de la demi longueur d'onde de fonctionnement du laser dans le matériau de rebouchage. Par ailleurs, la même tolérance que celle acceptée pour les réflecteurs latéraux peut être envisagée pour cette distance optique.

25 Une telle structure permet de fonctionner avec une longueur d'onde d'environ 1550 nm dans l'air.

L'invention ne se limite pas aux modes de réalisation décrits ci-avant, seulement à titre d'exemple, mais elle englobe toutes les variantes que pourra envisager l'homme de l'art dans le cadre des revendications ci-après.

REVENDICATIONS

1. Laser semi-conducteur, comprenant un guide d'onde actif (3) s'étendant selon des directions longitudinale (X), latérale (Y) et verticale (Z),
5 comportant une région active (4), entouré d'un matériau de rebouchage (5) et couplé à un réflecteur distribué (7,8), caractérisé en ce que ledit réflecteur distribué (7,8) est réalisé dans ledit matériau de rebouchage (9) le long d'au moins un des côtés latéraux de la région active (4) et sensiblement parallèlement à ceux-ci, sous la forme d'au moins une première structuration
10 (7,8) présentant une bande photonique interdite selon ledit axe longitudinal (X).

2. Laser selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite première structuration (7,8) s'étend sur une partie au moins de l'extension (h) de la région active (4) suivant la direction verticale (Z), et sur une partie au moins
15 de l'extension (h) du matériau de rebouchage (5) suivant la direction verticale (Z).

3. Laser selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que ladite première structuration (7,8) est un premier cristal photonique formé par gravure localisée du matériau de rebouchage (5) de façon à y former des
20 colonnes (9) creuses ou à y laisser subsister des colonnes de matériau, ces colonnes constituant un réseau périodique d'éléments diffractants présentant dans un plan horizontal une maille ayant des dimensions de l'ordre de la longueur d'onde de fonctionnement du laser.

4. Laser selon la revendication 3, caractérisé en ce que lesdites
25 colonnes (9) s'étendent sensiblement parallèlement à ladite direction verticale (Z) de la région active (4).

5. Laser selon l'une des revendications 3 ou 4, caractérisé en ce que ladite maille de réseau du premier cristal photonique a une forme de polygone convexe.

30 6. Laser selon la revendication 5, caractérisé en ce que ledit polygone est un polygone régulier.

7. Laser selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que ladite première structuration (7,8) est espacée des côtés latéraux de la région active d'une distance (d) sensiblement constante.

8. Laser selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que ladite première structuration (7,8) est espacée des côtés latéraux de la région active d'une distance (d_1 , d_2) qui varie le long de l'extension (L) de ladite région active (4) suivant la direction longitudinale (X).

9. Laser selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que ledit guide d'onde actif comporte, à l'une au moins des extrémités longitudinales de la région active (4), un matériau de rebouchage (5) dans lequel sont formés, à une distance δL de la première structuration (7,8), des moyens de réflexion (10) réalisés sous la forme d'une seconde structuration à bande photonique interdite et s'étendant sensiblement parallèlement à l'extension (l) de la région active (4) suivant la direction latérale (Y).

10. Laser selon la revendication 9, caractérisé en ce que ladite seconde structuration (10) s'étend au moins sur toute l'extension (h) de la région active (4) suivant la direction verticale (Z).

11. Laser selon l'une des revendications 9 ou 10, caractérisé en ce que ladite seconde structuration (10) s'étend sur toute l'extension (l) de la région active (4) suivant la direction latérale (Y) et sur une partie au moins de l'extension du matériau de rebouchage (5) suivant la direction latérale (Y).

12. Laser selon l'une des revendications 9 à 11, caractérisé en ce que ladite seconde structuration (10) est un second cristal photonique formé par gravure localisée du matériau de rebouchage (5) de façon à y former des colonnes (13) creuses ou à y laisser subsister des colonnes de matériau, ces colonnes constituant un réseau périodique d'éléments diffractants présentant dans un plan horizontal une maille ayant des dimensions de l'ordre de la longueur d'onde de fonctionnement du laser.

13. Laser selon la revendication 12, caractérisé en ce que lesdites colonnes (13) s'étendent sensiblement parallèlement à ladite direction verticale (Z) de la région active (4).

14. Laser selon l'une des revendications 12 ou 13, caractérisé en ce que ladite maille de réseau du second cristal photonique a une forme de polygone convexe.

15. Laser selon la revendication 16, caractérisé en ce que ledit polygone
5 est un polygone régulier.

16. Laser selon l'une des revendications 9 à 15, caractérisé en ce que
ladite distance δL est sensiblement égale à un nombre entier de fois la demie
longueur d'onde de fonctionnement du laser dans le matériau de rebouchage,
de sorte que les première et seconde structurations (7,8 ;10) définissent une
10 cavité résonnante de type Fabry-Pérot.

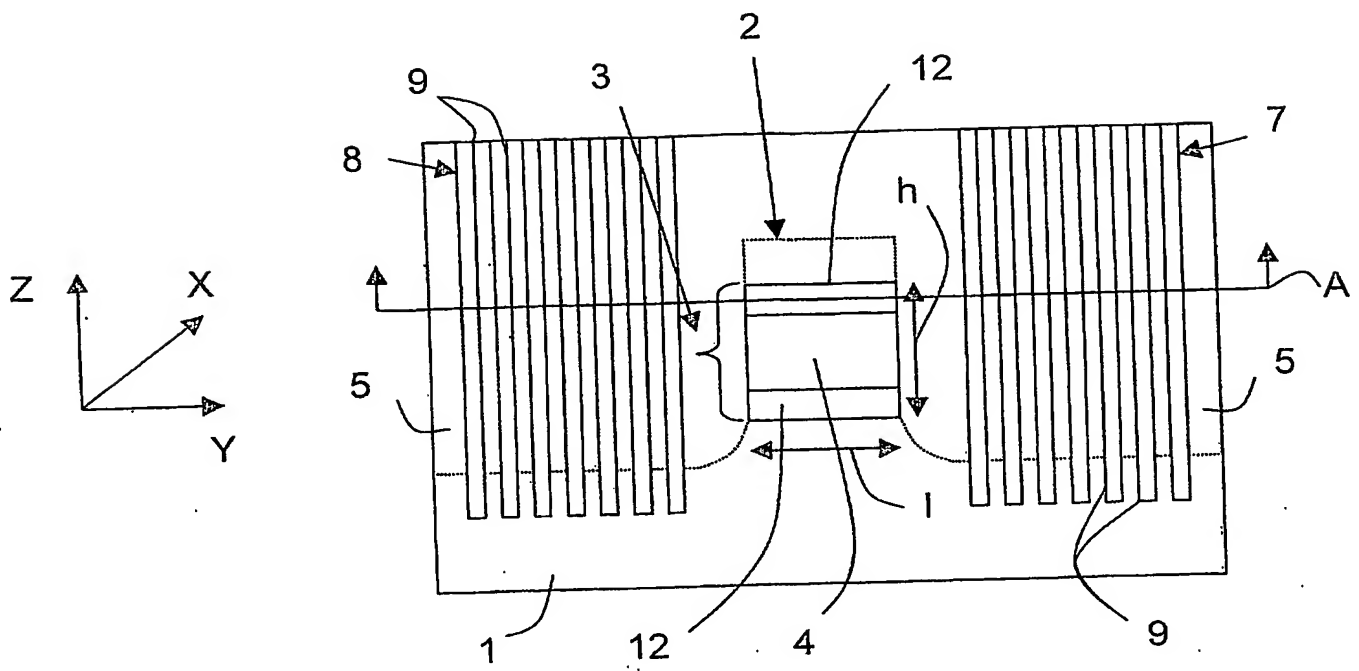


FIG. 1

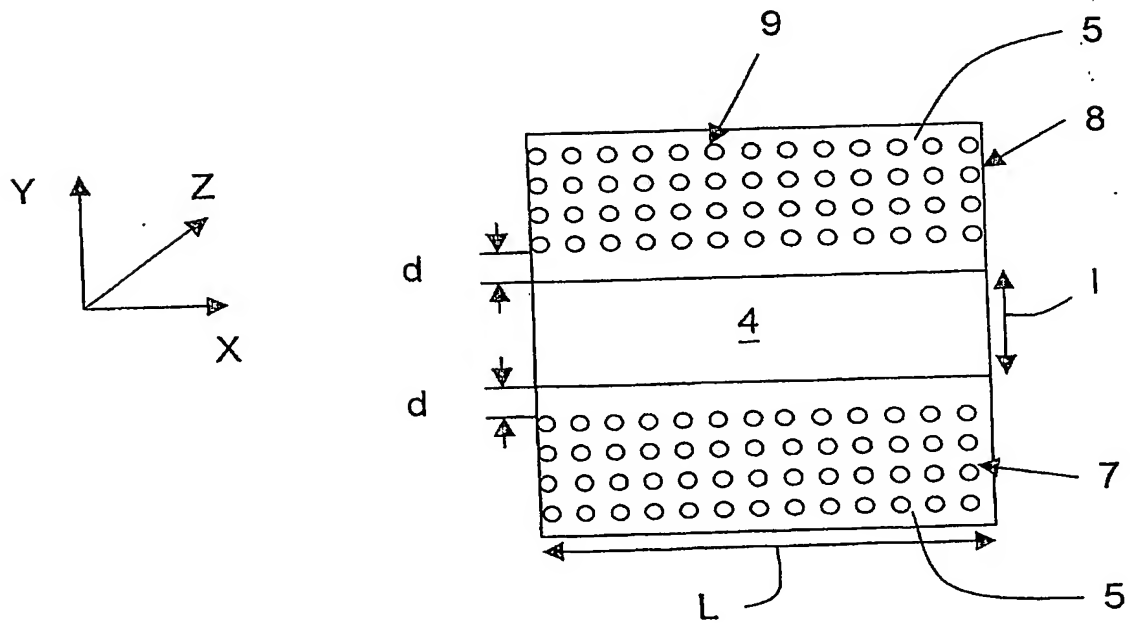


FIG. 2

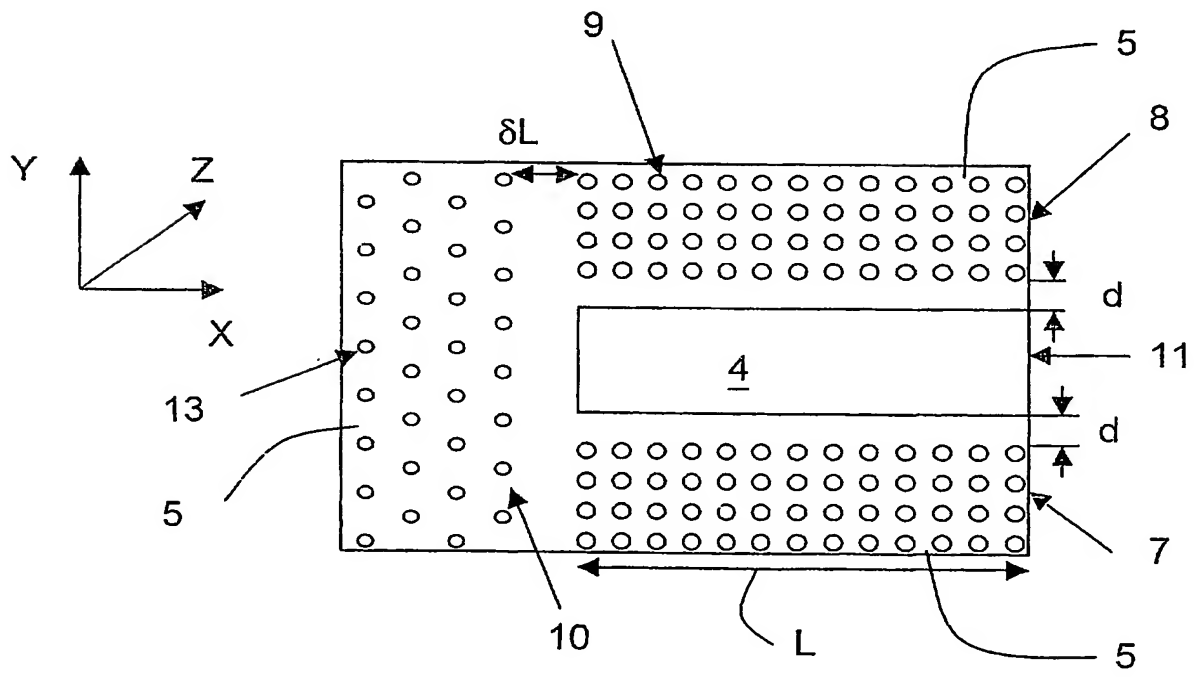
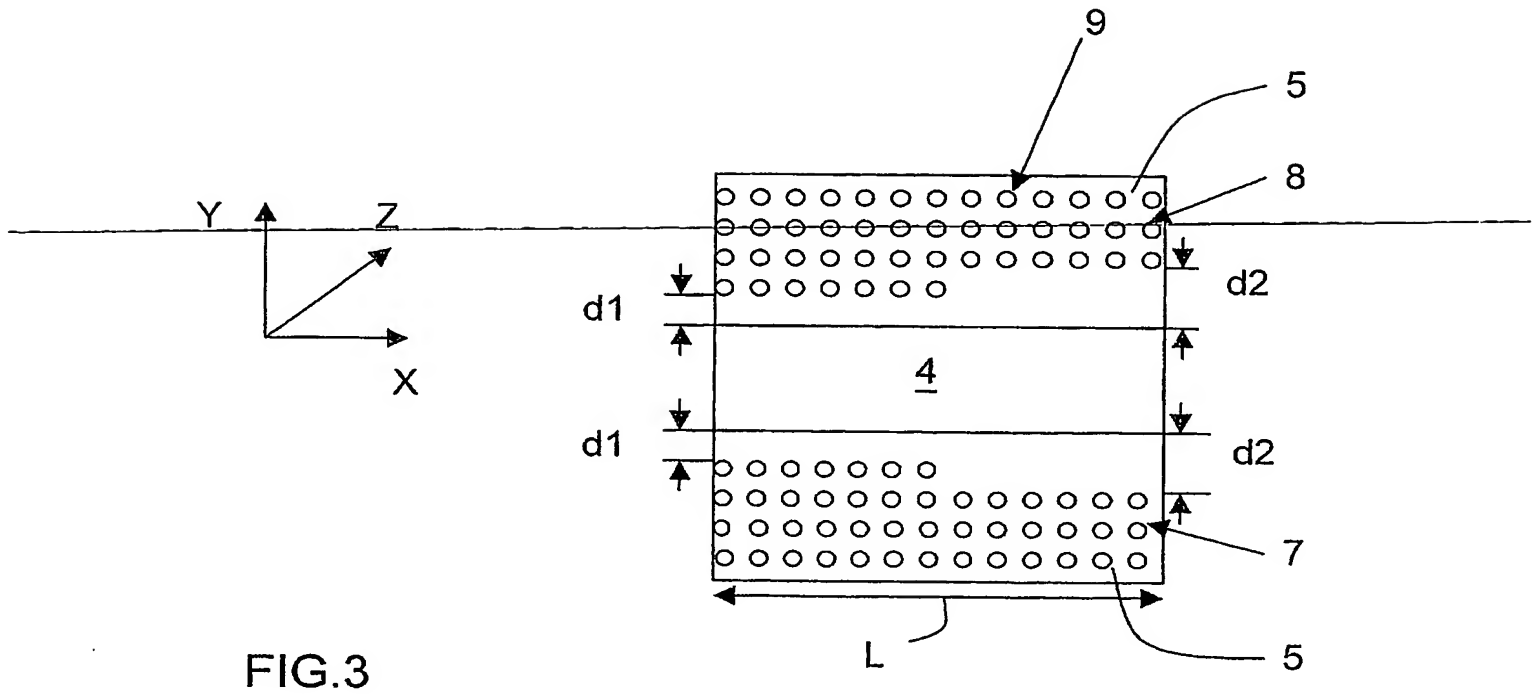


FIG. 4

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11235*02

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° .1./1.

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DD 113 W / 26-2002

Vos références pour ce dossier (facultatif)		104308/RF/OOCD/TPM	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		020 8543 9	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) LASER DFB A REFLECTEUR DISTRIBUE A BANDE PHOTONIQUE INTERDITE			
LE(S) DEMANDEUR(S) : Société anonyme ALCATEL			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		THEDREZ	
Prénoms		Bruno	
Adresse	Rue	C/o ALCATEL CIT ROUTE DE NOZAY	
	Code postal et ville	91460 MARCOUSSIS, FRANCE	
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		5 juillet 2002 Michel Robert FOURNIER 	

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.